Se	arch Notes

Application/C	ontrol No.
---------------	------------

10/506,591

Examiner
Huan H. Tran

Applicant(s)/Patent under Reexamination

LEHMANN ET AL.

Art Unit

2861

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
		•			

	INTERFERENCE SEARCHED					
	Class	Subclass	Date	Examiner		
-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	<u> </u>					
l						

(INCLUE	DATE	EXMR
. ,	 	
EAST	10/20/2005	ННТ
•		
•		
•		
•		
•		
	,	
•		